Search Notes

Application/Control No. Applicant(s)/Patent unde Reexamination		r
10/685,453	CHUNG, DAVID B.	
Examiner	Art Unit	-
HOAN C. NGUYEN	2871	

	SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
349	2	3/23/2006	CHN		
			,		
*		· ,	-		
		. ,			

· INT	ERFERENC	ERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner	
		-		
		_		
		:		
			· · · · ·	
	-			

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
	DATE	EXMR		
East search in US-PGPUB, USPAT, EPO, JPO	3/23/2006	CHN		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-		